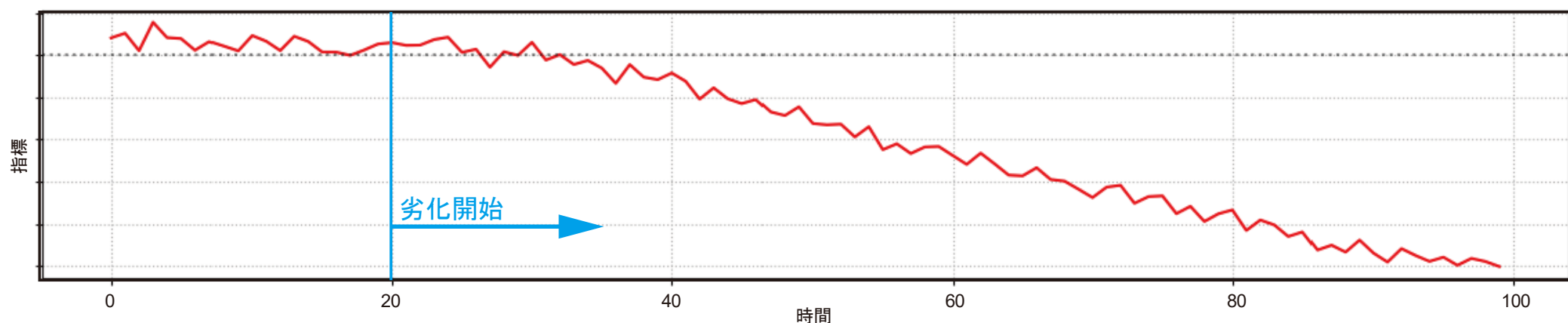


分析装置の性能評価技術

-分析装置の性能劣化を早期に発見-

- 材料科学の分野では、X線光電子分光装置(XPS) やフーリエ変換赤外分光器 (FT-IR) 等の精密な分析装置が用いられています。分析装置の劣化を早期に発見することにより、測定データの品質と信頼性を維持し、科学的発見の正当性や工業製品の品質保証を担保することができます。分析装置の劣化を発見する指標として、分析装置の感度やノイズの絶対値等が従来から用いられていました。しかし、これらの指標には、異常を検知した時点では分析装置の劣化がある程度進行しており、異常の早期発見が難しいという問題がありました。
- NIMSは、分析装置の劣化を早期に発見できる技術を開発しました。この技術によれば、劣化を早期に発見して装置のメンテナンス等を行い、測定データの品質と信頼性を維持することができます。更に、品質や信頼性に乏しい測定データで装置のキャリブレーションを行う危険性を未然に防止し、装置を適格にキャリブレーションすることもできます。この技術は、分析装置にアプリで後付けすることもできます。

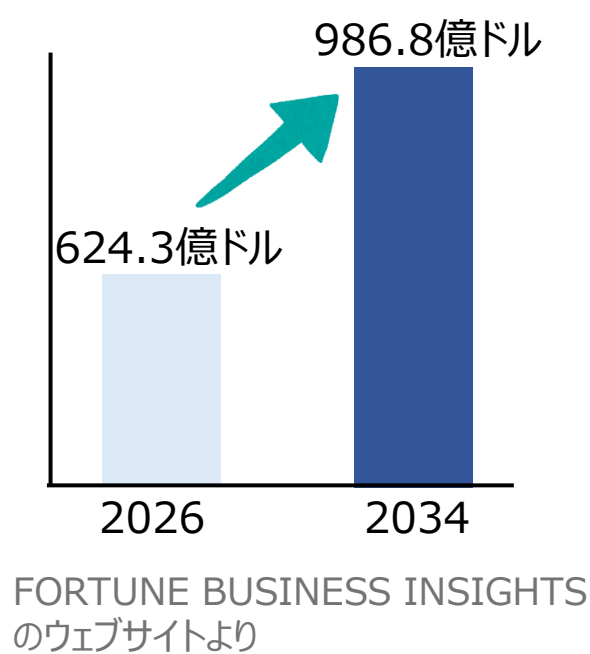


本技術による装置劣化の検出結果

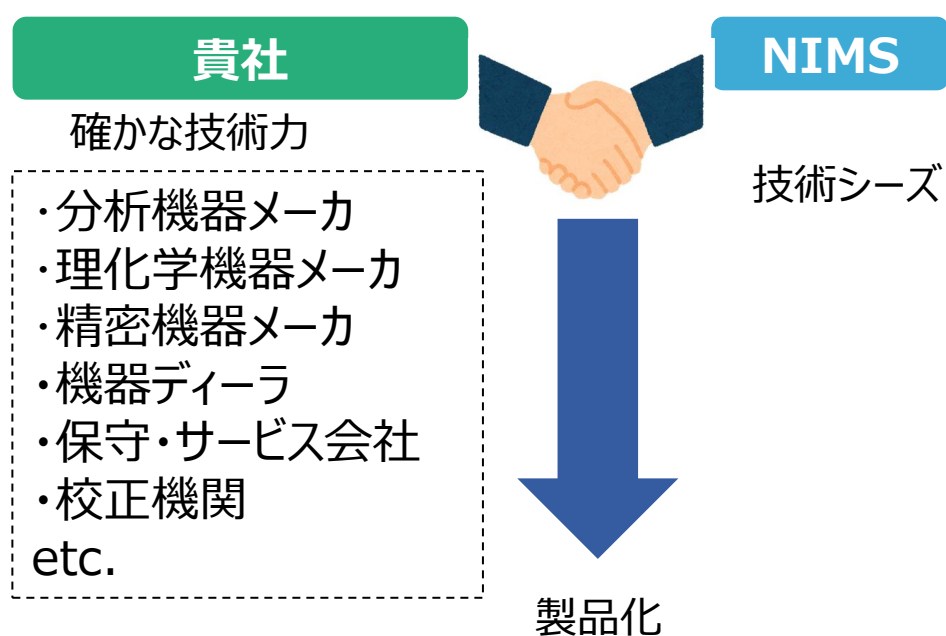
- 本技術の実用化に向け、技術ライセンスの供与または共同研究をご検討頂けるパートナー企業を募集しております。本技術にご興味をお持ち頂けましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

分析装置市場への技術参入をNIMSとともに！

分析装置 市場規模の成長性



連携フロー



貴社のメリット

